

走査型電子顕微鏡・エネルギー分散型X線解析装置

株式会社日立製作所製 Natural SEM s-2380N型・株式会社堀場製作所製 EMAX Energy



走査型電子顕微鏡・エネルギー分散型X線解析装置

走査電子顕微鏡は細く絞った電子線で試料上を走査させ、試料からの二次電子像あるいは反射電子像を観察することで、試料を高倍率で拡大観察することが可能です。

エネルギー分散型X線解析装置は、電子顕微鏡で拡大画像を詳細に観察しながら、目的とする部分について、元素の定性・定量分析が可能です。解析可能な元素範囲も広く、電子顕微鏡画像との連動により、迅速かつ高精度な解析が可能です。

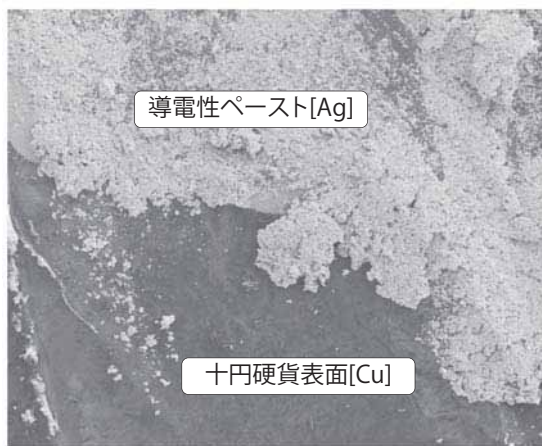
機械仕様

走査型電子顕微鏡

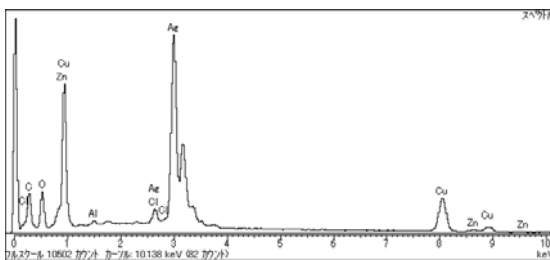
● 分解能(高真空)	4nm
● // (N-モード)	5.5nm
● 倍率	20~200,000倍
● 加速度電圧	0.5~30kV
● 最大試料寸法	φ50mm

エネルギー分散型X線解析装置(EDX)

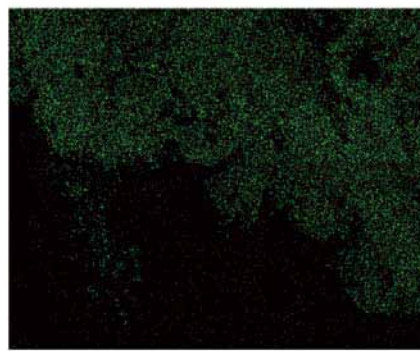
● エネルギー分解能	133eV
● 元素範囲	Be~U
● 分析深度(参考値)	1μm
● 分析データ	一括管理



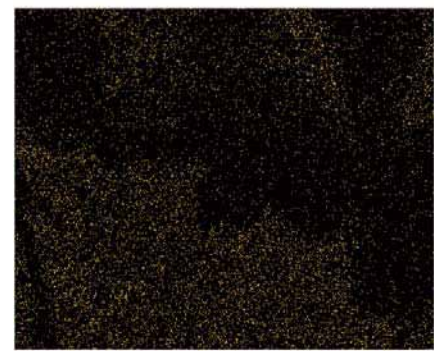
電子顕微鏡写真
(十円硬貨[Cu]の上に導電性ペースト[Ag])



スペクトル強度



(導電性ペースト[Ag])



(十円硬貨[Cu])
マッピング解析結果

使用料・手数料

- 設備利用: 1時間 4,330円 [電子顕微鏡]
- 依頼試験: 1箇所 6,580円 [電子顕微鏡試験(走査電子顕微鏡測定)]
1箇所 8,980円 [電子顕微鏡試験
(エックス線マイクロアナライザーによる高速定性分析)]

www.pref.yamanashi.jp/kougyou-fj/

YAMANASHI PREF. FUJI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER

〒403-0004 山梨県富士吉田市下吉田6-16-2 TEL:0555-22-2100 FAX:0555-23-6671 DIAL-IN 総機部:0555-22-2101 機械電子部:0555-22-0944



山梨県富士工業技術センター